

## Deutsche Akkreditierungsstelle

### Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19637-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab:** 16.10.2023

Ausstellungsdatum: 16.10.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

**OFG-Oberflächen-Festkörper-Grenzflächen Analytik GmbH**  
**Mendelstraße 11, 48149 Münster**

mit dem Standort

**OFG-Oberflächen-Festkörper-Grenzflächen Analytik GmbH**  
**Mendelstraße 11, 48149 Münster**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

**qualitative physikalisch-chemische Untersuchungen an Oberflächen und Grenzflächen wie auch in den Volumina von anorganischen und organischen Materialproben wie Schichten, Lacken, Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und Pulvern**

*Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen ([www.dakks.de](http://www.dakks.de))*

**Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19637-01-00**

OFG-P1 2018-11	Charakterisierung von organischen und anorganischen Materialien mittels TOF-SIMS - Oberflächen- und Volumen-Untersuchungen
OFG-P2 2018-11	Charakterisierung von organischen und anorganischen Materialien mittels ATR-FT-IR Spektroskopie
OFG-P3 2018-11	Ortsaufgelöste Charakterisierung von organischen und anorganischen Materialien mittels IR-Mikroskopie/IR-Mapping/IR- Imaging - Oberflächen- und Volumenuntersuchungen

**Verwendete Abkürzungen:**

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung
OFG-P	Hausverfahren der OFG Oberflächen-Festkörper-Grenzflächen Analytik GmbH